

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 23 年 7 月 7 日 (2011.7.7)

【公表番号】特表 2010-536035 (P2010-536035A)

【公表日】平成 22 年 11 月 25 日 (2010.11.25)

【年通号数】公開・登録公報 2010-047

【出願番号】特願 2010-520011 (P2010-520011)

【国際特許分類】

G 0 1 N 27/26 (2006.01)

G 0 1 N 27/416 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 27/26 3 8 1 A

G 0 1 N 27/46 3 3 8

G 0 1 N 27/46 3 3 6 B

【手続補正書】

【提出日】平成 23 年 5 月 17 日 (2011.5.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

静電容量測定及び無線周波数測定のうち 1 つを基にして、校正記憶デバイスに含まれるパターンからデータを収集するセンサアレイと、

センサアレイからデータを受信して、データに従ってデバイスを校正するプロセッサと

、

を含むデバイス。

【請求項 2】

校正が、校正記憶デバイスとともに機能を行うようにデバイスを準備することを含む、請求項 1 記載のデバイス。

【請求項 3】

機能が、校正記憶デバイスによって受容された試料の診断試験である、請求項 2 記載のデバイス。

【請求項 4】

パターンが、高さ、幅及びコントラストのうち少なくとも 1 つの、複数の変形を含む、請求項 1 記載のデバイス。

【請求項 5】

静電容量測定及び無線周波数測定のうち少なくとも 1 つを用いて、校正記憶デバイス上に含まれるパターンを読み取ることと、

パターンに含まれるデータを判定することと、

データに従ってデバイスを校正することであって、その校正が、校正記憶デバイスとともに機能を行うようにデバイスを準備することを含むことと、

を含む方法。

【請求項 6】

機能が、校正記憶デバイスによって受容された試料の診断試験である、請求項 5 記載の方法。

【請求項 7】

パターンが、一次元及び二次元シーケンスの少なくとも１つを含む、請求項５記載の方法。

【請求項８】

パターンが二次元シーケンスの場合、二次元シーケンスを読み取るための一次元センサアレイを通過させて二次元シーケンスをスライドさせることをさらに含む、請求項７記載の方法。

【請求項９】

パターンが、高さ、幅及びコントラストのうち少なくとも１つの、複数の変形を含む、請求項５記載の方法。

【請求項１０】

分析対象物計によって、分析対象物受容片を受容することと、
静電容量測定及び無線周波数測定のうち少なくとも１つを用いて、分析対象物受容片上に配設されたパターンを読み取ることと、
パターン内に含まれた較正データを判定することと、
較正データに従って、分析対象物計を較正することと、
分析対象物片上に分析対象物を受容することと、
較正された分析対象物計を用いて、分析対象物を分析することと、
分析結果を表示することと、
を含む方法。